

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA



INSTITUTO DE FÍSICA
“Luis Rivera Terrazas”



SEMINARIO
“DR. JESUS REYES CORONA”

“Métodos no Convencionales de Microscopia de Barrido de Sonda para la Caracterización de Materiales”

Dr. Francisco Javier Flores Ruíz
Investigador de cátedra CONACyT – IFUAP.

La Microscopia de Barrido de Sonda tiene tres clasificaciones: Microscopia de Barrido de Fuerzas; Microscopia de efecto túnel; y Microscopia de Campo Óptico Cercano. En esta plática se abordará la Microscopia de Barrido de Fuerzas como una herramienta para medir propiedades físicas de las superficies de los materiales a niveles de nano y micro escala. Se describirán algunos métodos que se han desarrollado y/o implementado para medir cuantitativamente propiedades elásticas, ferroeléctricas, piezoeléctricas, así también como de conmutación ferroeléctrica a escala nanométrica. También se describirá el desarrollo de un método que permite seguir el desempeño tribológico y las propiedades mecánicas a micro-escala de las superficies de los materiales.

Auditorio-IFUAP

Viernes 23 de junio de 2017
13:00 Hrs.